Рентгеноспектральное изучение электронной структуры и локализации атомов водорода в гидридах HfTi₂H_x

© С.Н. Немнонов, В.М. Черкашенко, В.Н. Кожанов, А.В. Скрипов, Э.З. Курмаев, Е.П. Романов

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

E-mail: nemnonov@ifmlrs.uran.ru

(Поступила в Редакцию 7 декабря 2004 г. В окончательной редакции 25 апреля 2005 г.)

Изучены спектральные характеристики Ті $K\beta_5$ -спектров и электронная структура гидридов HfTi₂H_x (x = 0, 0.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.95). Определена локализация атомов H, а также рассчитана степень заселенности атомами водорода *e*- и *g*-позиций. Сделан вывод, что при малых концентрациях водорода (вплоть до x = 3.0) происходит заселение только *e*-позиций (это подтверждается и кристаллографическими экспериментами), а с ростом концентрации водорода происходит заселение не только *e*-, но и *g*-позиций.

Работа поддержана Советом по грантам Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (грант HIII-1026.2003.2).

PACS: 61.10.Nz, 61.66.Fn

1. Введение

Известно, что Hf и Ti образуют только разупорядоченные твердые растворы с гексагональной плотной упаковкой (решетка ГПУ). В последнее время усилился интерес к проблеме фазовых переходов типа порядокбеспорядок в системах внедрения. Возможность существования таких переходов следует непосредственно из того обстоятельства, что обычно в твердых растворах внедерения число междоузлий превышает число внедренных атомов. Естественно ожидать, что при высоких температурах реализуется статистическое распределение внедренных атомов по междоузлиям, в то время как при понижении температуры возможна "кристаллизация" внедренных атомов в кристаллическом поле атомов матрицы. Характерно, что такая "кристаллизация", приводящая к упорядоченному расположению внедренных атомов по междоузлиям, должна быть связана с взаимодействиями одного типа, а именно с взаимодействиями между внедренными атомами, в то время как выбор типа занимаемого междоузлия (октаэдр, тетраэдр) определяется взаимодействиями с атомами матрицы. Интересен эффект поглощения водорода в сплавах со стимулированным водородом упорядочением решетки матрицы [1-3]. Механизм стимулирования водородом упорядочения в различных сплавах не вполне ясен. Недавно сообщалось об обнаружении новой водородно-стимулированной упорядоченной фазы в системе HfTi2-H [4]. В этой работе с использованием рентгеновской дифракции было проведено изучение структуры и фазового состава образцов, образующихся при взаимодействии сплава HfTi₂ с водородом. Среди фаз HfTi₂H_r, соответствующих различным концентрациям Н, была найдена кубическая фаза с упорядоченной решеткой матрицы типа С15 (фазы Лавеса). Подобная стабилизация водородом фазы типа С15 была ранее обнаружена в системе $ZrTi_2-H(D)$ [1,5].

Проведенные ранее исследования подобных систем посвящены в основном изучению фазовых переходов, фазового состава, структурных параметров, а также изучению влияния содержания Н на параметр порядка решетки [1,4,5]. Работ, посвященных выявлению занимаемых водородом позиций с помощью рентгеноструктурного анализа, очень мало. В первую очередь это обстоятельство связано с тем, что большинство твердых растворов внедрения представляет собой системы, состоящие из атомов, существенно различающихся по массе, а в этом случае определение локализации более легких атомов обычными методами рентгноструктурного анализа затруднено из-за их слабой рассеивающей способности по сравнению с атомами матрицы. В литературе приводятся результаты электронноспектроскопических и рентгеноспектральных исследований электронно-энергетического спектра "обычных" фаз Лавеса и их гидридов. Наблюдаемые особенности в спектрах гидридов, как правило, не соотносятся с типом занимаемых водородом кристаллографических позиций, в то время как это является одной из наиболее важных характеристик гидридов [6–9].

По-видимому, только нейтронографические методы дают прямой ответ на вопрос о локализации атомов внедрения. В стабилизированных водородом фазах $HfTi_2H(D)_x$ и $ZrTi_2H(D)_x$, а также в $ZrV_2H(D)_x$ степень заселенности изменяется с температурой и, возможно, с содержанием водорода [1,4,6,10–12]. Достаточно обнадеживающие результаты по определению локализации атомов водорода получены нами при изучении рентгеновских эмиссионных спектров в гидридах Ti_3SbH_x [13]. В настоящей работе развивается метод, предложенный в [13], и предпринята попытка определения не только локализации атомов водорода, но и степени заселенности атомами водорода тех или иных позиций в системе $HfTi_2H_x$. Представляет также интерес сравнить спектральные характеристики различных гидридных фаз

2. Приготовление образцов и методика эксперимента

В настоящей работе исследованы практически однофазные образцы квазибинарного разреза $HfTi_2H_x$ (x = 0, 0.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.95), структура которых была подробно изучена ранее в работе [4]. Для x = 0.5 основной фазой был первичный твердый раствор водорода в ГПУрешетке исходного сплава $HfTi_2$ (α -фаза), для x = 3.0, 4.0, 4.5 — стабилизированная водородом кубическая фаза Лавеса (λ фаза), для x = 5.95 — дигидридная δ -фаза с тетрагонально искаженной структурой CaF₂.

Параметры решетки и фазовый состав исследуемых образцов приведены в табл. 1. Рентгеновские дифракционные измерения при комнатной температуре были проведены на образцах $HfTi_2H_x$ (0.5 < x < 5.95) на дифрактометре ДРОН-2.0 с CoK_α -излучением. Более детальное описание методики приготовления образцов, а также все данные по рентгеновской дифракции с указанием обнаруженных фаз приведены в работе [4].

Таблица 1. Результаты рентгенодифракционного исследования гидридов HfTi₂H_x при комнатной температуре

Образец	Фаза	Параметры решетки, Å
$\begin{array}{l} HfTi_{2}H_{0.5} \\ HfTi_{2}H_{3.0} \\ HfTi_{2}D_{4.0} \\ HfTi_{2}H_{4.5} \end{array}$	α λ λ λ	a = 3.061(5), c = 4.815(5) a = 8.081(5) a = 8.0791(2) a = 8.092(5)
$HfTi_2H_{5.95}^*$	δ	a = 4.624(5), c = 4.429(5)

* Для состава HfTi₂H_{5.95} кроме основной δ -фазы имеется примесь λ -фазы с параметром a = 8.112(5) Å.

Флуоресцентные рентгеновские спектры $\text{Тi}K\beta''\beta_5$ (1*s*-4*p*-переход) получены на флуоресцентном рентгеновском спектрометре с позиционно-чувствительным детектором ФРС-КД-1 [14] с инструментальным разрешением 0.3 eV. Погрешность определения энергетического положения максимумов этих спектров составляла ± 0.1 eV. Условия эксперимента были следующими: кристалл-анализатор — кварц, радиус изгиба кристалла 2000 mm, первичное излучение — $\text{Сu}K_a$, режим работы трубки V = 30 kV, I = 50 mA. Накопление спектров проводилось до достижения в максимуме $K\beta_5$ -полосы ≈ 3000 импульсов.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Полученные спектры представлены на рис. 1. Распределение интенсивности $K\beta_5$ -спектра в исходном HfTi₂



Рис. 1. Ті $K\beta_5$ -полосы гидридов HfTi₂H_x (x = 0, 0.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.95).

и гидрированных соединениях (HfTi₂H_x) аналогично наблюдаемому для исследованных ранее соединений со структурой C15 (ZrV₂ и ZrV₂D_x) [6], (Zr_xHf_{1-x}V₂) [7], что позволяет провести следующую интерпретацию. Подполоса A в Ті $K\beta_5$ -спектре имеет 3d-характер и формируется за счет Ті4*p*-Ті3*d*-взаимодействия. При внедрении водорода в HfTi₂ в Ti $K\beta_5$ -спектре на расстоянии $\approx 5.1 \,\mathrm{eV}$ от подполосы A появляется новая подполоса В, интенсивность которой растет с увеличением концентрации растворенного водорода. Одновременно происходит уменьшение интенсивности подполосы А. Отметим, что на таком же расстоянии от *d*-подобной полосы дополнительный пик появляется и в спектрах простых гидридов Ті и V [8,9] и дейтеридов фаз Лавеса [6]. Появление этого пика связывалось с гибридизацией 4р-состояний излучающего атома и 1s-состояний водорода или дейтерия. Очевидно, и в нашем случае этот пик следует связать с Ti4p-H1sгибридизацией. Таким образом, введение водорода в решетку HfTi2 приводит к образованию локализованной подполосы, связанной с распределением 1s-состояний водорода. Поскольку атом водорода вносит только один электрон, для заполнения этой полосы недостающий электрон приходит из высокоэнергетической d-подобной подполосы А. Это приводит к уменьшению заселенности этой подполосы и как следствие к уменьшению ее интенсивности в Ті $K\beta_5$ -спектре. Следует, однако, отметить, что наблюдаемое уменьшение интенсивности подполосы А

Образец	$K\beta_1, eV$	$K\beta_5(A), eV$	$K\beta_{\rm H}(B), {\rm eV}$	$\frac{I_{K\beta_{\rm H}}(B)}{{I_{K\beta_1}}^*}$	$\frac{I_{K\beta_5}(A)}{{I_{K\beta_1}}^*}$
HfTi ₂	4931.78	4962.66		0.310	0.767
HfTi ₂ H _{0.5}	4931.94	4962.82		0.275	0.674
HfTi ₂ H _{3.0}	4931.62	4962.82	4957.54	0.623	0.577
HfTi ₂ D _{4.0}	4931.62	4962.98	4957.7	0.782	0.492
HfTi ₂ H _{4.5}	4931.62	4962.66	4957.7	0.797	0.414
HfTi ₂ H _{5.95}	4931.62	4962.02	4957.7	0.779	0.223

Таблица 2. Положение линий $K\beta_1$, $K\beta_5(A)$, $K\beta_H(B)$ титана и относительная интенсивность полос $K\beta_H(B)$ и $K\beta_5(A)$

* Здесь используется интегральная интенсивность ΤiKβ₁-полосы.

нельзя полностю объяснить уменьшением заселенности *d*-подобной полосы.

В табл. 2 приведены энергетические положения подполос в Ті $K\beta_5$ -спектре, а также значения спектральных интенсивностей подполос, нормированных на интегральную интенсивность внутренней Ті $K\beta_1$ -линии. Как уже отмечалось, увеличение концентрации водорода приводит к увеличению интенсивности β -подполосы в Ті $K\beta_5$ спектре, связанной с Ті4p—H1s-взаимодействием (далее в тексте интенсивность B-подполосы в Ті $K\beta_5$ -спектре будем обозначать $K\beta_{\rm H}$).

Однако интенсивность этой подполосы увеличивается нелинейно с концентрацией Н. Это хорошо видно из табл. 2 и на рис. 2. В гидридах $AB_2H_x(D_x)$ со структурой C15 атом водорода может занимать два типа тетраэдрических междоузельных позиций (рис. 3): $32e(AB_3)$ и $96g(A_2B_2)$. Для ZrTi₂H_x заняты преимущественно е-позиции [1,10]. Заполнение всех е-позиций соответствует x = 4.0 [10]. В работе [4] обнаружено, что для системы $HfTi_2H_x$ даже при x = 4.5 сохраняется однофазное состояние. Это означает, что существование λ -фазы в HfTi₂H_x не подразумевает заполнения только е-позиций. Нарушение линейной зависимости интенсивности полосы В от концентрации атомов водорода может быть связано с изменением ближайшего окружения титана как за счет гидрирования, так и за счет фазового перехода при одной из этих концентраций (4.0, 4.5, 5.95). Интересно отметить, что параметр порядка решетки матрицы в λ-фазе, стабилизированной водородом, зависит от х. На рис. 4 показано отношение интенсивностей брэгговских пиков (220) и (222) I₂₂₀/I₂₂₂ для λ-фазы в зависимости от общего содержания Н. В соединениях АВ₂ типа C15 это отношение должно быть чувствительным к атомному конфигурационному разупорядочению [15]. Для полностью упорядоченной решетки матрицы λ -фазы получено значение $I_{220}/I_{222} = 10.8$. Параметр порядка решетки металла-основы, оцененный из экспериментальных данных по I_{220}/I_{222} согласно [15], изменяется от 0.67 для x = 2.0 до 0.96 для x = 5.5. Понимая, что зависимость I₂₂₀/I₂₂₂ определяется степенью дальнего порядка в металлической матрице и различием атомных факторов рассеяния, а зависимость $K\beta_{\rm H}/K\beta_{\rm 1}$ главным образом степенью заполнения междоузлий, мы отмечаем сходство зависимостей I_{220}/I_{222} и $K\beta_{\rm H}/K\beta_1$ от концентрации водорода.

Дополнительную информацию о причинах отклонения зависимости $K\beta_{\rm H}/K\beta_1$ от линейной дает рис. 5, где приведены Ті $K\beta_5$ -полосы для образцов с x = 4.0, 4.5 и 5.95, нормированные на интегральную интенсивность внутренней Ті $K\beta_1$ -линии. Интенсивность подполосы A



Рис. 2. Зависимость спектральных интенсивностей подполос A и B от содержания H (D для состава с x = 4.0) в образцах.



Рис. 3. Фрагмент кристаллической структуры $HfTi_2H_x$. Атомы Н могут занимать два типа междоузлий: *е* и *g*. Междоузлия *е* образуются одним атомом Hf и тремя атомами Ti (HfTi₃), а междоузлия *g* — двумя атомами Hf и двумя атомами Ti (HfTi₂).



Рис. 4. Отношение интенсивностей брэгтовских пиков (220) и (222) *I*₂₂₀/*I*₂₂₂.



Рис. 5. Ті $K\beta_5$ -полосы для образцов с x = 4.0, 4.5, 5.95, нормированные на интегральную интенсивность Ті $K\beta_1$ -полосы.

Таблица 3. Межатомные расстояния Ti–H, число связей на один атом Ti, квадраты интегралов перекрытия S_{ps}^2 в *e*- и *g*-позициях и относительные интенсивности подполос *B*, *A* однофазных гидридов HfTi₂H_x

Образец	d(Ti–H), Å		Число связей		S_{ps}^2 , eV^2		$\frac{I_B}{I_{KB_*}}$	$\frac{I_A}{I_{KB_*}}$
	е	g	е	g	е	g	πp1	пр ₁
HfTi ₂ H _{3.0}	2.020	1.890	4.5	3.0	11.80	15.41	0.623	0.577
HfTi ₂ D _{4.0}	2.020	1.889	6.0	4.0	11.81	15.43	0.782	0.492
HfTi ₂ H _{4.5}	2.023	1.892	6.75	4.5	11.74	15.33	0.797	0.414
$HfTi_2H_{5.95}$	2.028	1.897	8.925	5.95	11.62	15.18	0.779	0.223

падает, а интенсивность подполосы В практически не изменяется. Не изменяются положение максимума полосы В и полуширина на половине высоты, что также свидетельствует о существовании перечисленных выше причин нелинейной зависимости интенсивности подполосы В. Уменьшение интенсивности *d*-подобной полосы с увеличением концентрации водорода в области x = 4.0 - 5.5 указывает на то, что часть электронов из этой зоны уходит на заполнение 1s-состояний водородоподобной полосы В. Поскольку интенсивность этой полосы (B) зависит от Ti4p-H1s-гибридизации и числа связей Ті-Н, неизменность ее интенсивности может свидетельствовать о том, что число связей Ті-Н при этом не изменяется. При увеличении концентрации водорода такая ситуация может иметь место, если при этом происходит и изменение преимущественной локализации атомов водорода из позиций HfTi₃ в позиции Hf₂Ti₂; тогда каждый атом водорода будет создавать не три связи Ті-Н, а только две.

Рассмотрим теперь характер изменения относительных интенсивностей подполос ТіК_{в5}-спектров и попробуем определить кристаллографические позиции, занимаемые атомами водорода. В работах [10-12] было показано, что в гидридах $HfTi_2H_x$ и $ZrTi_2H_x$ с $x \cong 4.0$ водород может занимать не только е-, но и д-позиции. Наше рассмотрение локализации атомов Н основано на интерпретации К_{β5}-спектров 3*d*-металлов в соединениях [16]. Согласно этой концепции, распределение интенсивности КВ5-спектра определяется гибридизацией 4р-состояний излучающего атома с состояниями валентных электронов атомов ближайшего окружения. При этом интенсивность соответствующих подполос в К_{β5}-спектре будет зависеть от числа атомов определенного сорта в ближайшем окружении и межатомных расстояний.

В табл. З приведены значения спектральных интенсивностей подполос, нормированные на интегральную интенсивность Ті $K\beta_1$ -полосы. Следует также отметить, что для состава с x = 5.95 в таблице указаны расстояния Ті–Н для λ -фазы, хотя это не совсем верно, так как основной фазой является δ -фаза с примесью λ -фазы. У этого состава уже иная структура с другими типами междоузлий и другими позициями для Н. Выше было отмечено, что увеличение концентрации водорода приводит к росту интенсивности *B*-подполосы в Ті $K\beta_5$ -спектре и что интенсивность этой подполосы увеличивается нелинейно с концентрацией Н. При концентрации водорода больше x = 4.0 наблюдается замедление роста интенсивности. Это отчетливо видно из рис. 2, где показаны изменения интенсивности *B*-подполосы относительно значения интенсивности $K\beta_1$ -спектра. В то же время при заполнении водородом междоузельных позиций только одного типа эта зависимость должна быть близка к линейной, так как в значительной степени определяется числом связей Ti-H, приходящихся на один атом Ti. Число связей *n* можно определить следующим образом:

$$n = zx/m,\tag{1}$$

где z — число ближайших к атому Ті атомов H, когда водородом полностю заняты те или иные позиции, m — максимальная концентрация водорода на формульную единицу. В случае *e*-позиций атомы Ti окружены октаэдром из атомов H ($z_e = 6$), а в случае *g*-позиций — двенадцатью атомами H ($z_g = 12$). Однако благодаря тому, что m = 4 для *e*-позиций и m = 12для *g*-позиций, число связей Ti-H в случае заполнения водородом *e*-позиций будет расти быстрее ($n_e = 1.5x$), чем в случае *g*-позиций ($n_g = x$). В первом приближении для интенсивности $K\beta_5$ -спектра можно записать

$$I \approx I_0 = nS_{ns}^2,\tag{2}$$

где S_{ps} — интеграл перекрытия Ti4p—H1s. Квадраты интегралов перекрытия для обеих позиций $(S_{ps} \approx 1.84h^2/md^2)$, оцененные по [17], приведены в табл. 3. Как видно, эти величины больше в g-позициях, что несколько выравнивает наклон зависимости I(x). На рис. 6 приведены рассчитанные по (2) значения I_0 в e-и g-позициях для составов с x = 3.0, 4.0, 4.5, 5.95.

Попытаемся определить количество H в этих позициях. Будем исходить из предположения, что при x = 3.0 занимаются только *e*-позиции (это подтверждено и данными эксперимента [1]), а при дальнейшем увеличении содержания H происходит заполнение и *e*-, и *g*-позиций. Тогда интенсивность, получаемую из эксперимента, можно представить как

$$I_{\exp} \approx kaI_e + kbI_g,\tag{3}$$

где I_e и I_g — интенсивности, рассчитанные по (2), k — нормировочный коэффициент (константа), a и b вклады в интенсивность e- и g-позиций соответственно. Формулу (3) можно привести к виду

$$\frac{I_{\exp}}{k} \approx aI_e + bI_g.$$

Вводя еще одно условие: a + b = 1, получаем систему из двух уравнений с двумя неизвестными, которая легко решается. Для состава с x = 4.0 получаем a = 0.825,



Рис. 6. Зависимость относительных интенсивностей подполос *В* и *A* от содержания водорода. *I* — эксперимент, 2, 3 — рассчитанные по формуле (2) значения I_0 в *e*- и *g*-позициях, *4* — полученные из решения уравнения (4) в предположении, что занимаются и *e*-, и *g*-позиции для составов с x = 3.0, 4.0, 4.5, 5.95.

b = 0.175, для состава с x = 4.5 a = 0.59, b = 0.41, для состава с x = 5.95 a = 0, b = 1.0. Это хорошо видно из рис. 6. А поскольку интенсивность зависит прямо пропорционально от состава x (концентрации H), можно рассчитать вклад e- и g-позиций в состав, т.е. x_e и x_g . Для состава с x = 4.0 получаем $x_e = 3.3$ и $x_g = 0.7$, для состава с x = 4.5 находим $x_e = 2.7$ и $x_g = 1.8$. При расчете мы использовали элементарные пропорции, из которых получили выражения

$$x_e = xa, \quad x_g = xb. \tag{5}$$

Зная количество возможных *e*- (32) и *g*-позиций (96) на элементарную ячейку, можно определить, сколько *e*- и *g*-позиций занято для соответствующего состава. Для этого можно использовать другие элементарные соотношения, из которых получаем

$$c_e = 8x_e, \quad c_g = 8x_g, \tag{6}$$

где c_e и c_g — заполнение e- и g-позиций соответственно. Предыдущие соотношения можно привести к более простому виду

$$c_e = 8xa, \quad c_g = 8xb, \tag{7}$$

а также рассчитать процент заполнения тех или иных позиций (e или g) с помощью отношения $c_e/32$ и $c_g/96$.

Подставляя c_e и c_g из (7), получаем значения e и g, выраженные через величины a и b, найденные при решении (4) из отношений xa/4 и xb/12 соответственно.

В результате при расчете на элементарную ячейку получаем, что при $x = 4.0 \ e$ -позиции заполнены на 82.5%, а g-позиции — только на 5.83%. При $x = 4.5 \ e$ -позиции заполнены на 67.5%, а g-позиции — на 15%. Для состава с x = 5.95 заполняются уже только g-позиции. Последнее утверждение, хотя оно и подтверждается видом зависимости на рис. 6, не совсем верно, так как при x = 5.95 меняется структура решетки, и изложенные выше рассуждения должны претерпеть изменения, касающиеся учета z и m в формулах (1) и (2) (для этой структуры), а также вида соотношений при расчете процентов заполнения e- и g-позиций.

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что при увеличении содержания H в $HfTi_2H_x$ свыше x = 4.0 не только "новые" водородные атомы располагаются в *g*-позициях, но и происходит переход водорода из ранее занятых *e*-позиций в *g*-позиции.

Список литературы

- H.Ф. Мирон, В.И. Щербак, В.Н. Быков, В.А. Левдик. Кристаллография 16, 2, 324 (1971).
- [2] T.B. Flanagan, A.P. Craft, T. Kuji, K. Baba, Y. Sugimoto. Scripta Met. 20, 1745 (1986).
- [3] A.V. Irodova, V.P. Glazkov, V.A. Somenkov, V.E. Antonov, E.G. Ponyatovsky. Z. Phys. Chem. N. F. 163, 53 (1989).
- [4] V.N. Kozhanov, A.V. Skripov, E.P. Romanov. J. Alloys Copm. 269, 141 (1998).
- [5] A.V. Skripov, S.V. Rychkova, M.Yu. Belyaev, A.P. Stepanov. Solid State Commun. 71, 1119 (1989).
- [6] Y.M. Yarmoshenko, V.N. Kozhanov, V.M. Cherkashenko, E.Z. Kurmaev, E.P. Romanov. Solid State Commun. 55, 1, 19 (1985).
- [7] V.V. Nemoshkalenko, V.J. Nagorniy, М.Т. Kogut, М.А. Mindlina, A.D. Shevchenko, I.E. Bulah. Металлофизика 3, 29 (1981).
- [8] М.М. Киндрат. Канд. дис. Киев (1982). 117 с.
- [9] И.А. Брытов, Э.З. Курмаев, К.И. Конашенок, М.М. Антонова. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 9, 1, 137 (1973).
- [10] A.V. Skripov, T.J. Udovic, Q. Huang, J.C. Cook, V.N. Kozhanov. J. Alloys. Comp. **311**, 234 (2000).
- [11] В.Н. Кожанов, А.В. Скрипов, А.П. Степанов, Е.П. Романов, А.Л. Бузлуков. ФММ 88, 5, 58 (1999).
- [12] P. Fischer, F. Fauth, G. Böttger, A.V. Skripov, V.N. Kozhanov. J. Alloys Comp. 282, 184 (1999).
- [13] С.Н. Немнонов, В.М. Черкашенко, Э.З. Курмаев, А.В. Скрипов. ФММ **78**, 78 (1994).
- [14] В.Е. Долгих, В.М. Черкашенко, Э.З. Курмаев, Д.А. Гоганов, Е.К. Овчинников, Ю.М. Ярмошенко, Т.П. Топоркова. ПТЭ 1, 186 (1985).
- [15] В.А. Финкель, Е.А. Пушкарев. ЖЭТФ 73, 2332 (1977).
- [16] В.И. Нефедов, Э.З. Курмаев, М.А. Порай-Кошиц, С.А. Немнонов, Г.В. Цинцадзе. ЖСХ 13, 4, 637 (1972).
- [17] У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел. Мир, М. (1983). Т. 1. 322 с.